

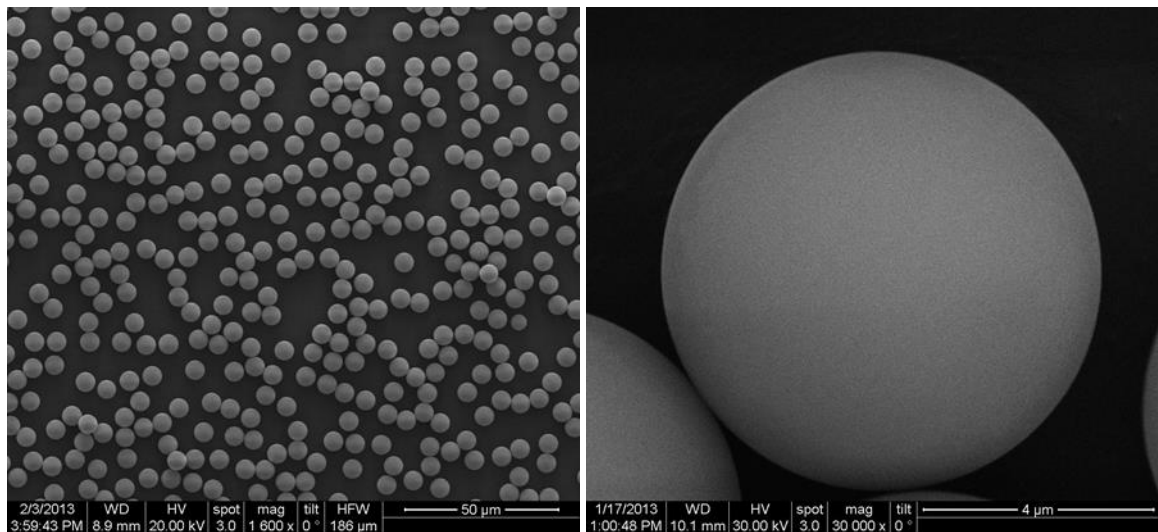
## UniSil®硅球间隔物

### 产品简介

UniSil®硅球间隔物，具有非常窄的粒径分布，能够精确地控制盒厚，不会对基板造成损坏，清晰度更高。纳微科技的硅球品种最多，应用最广泛。

### 产品特点

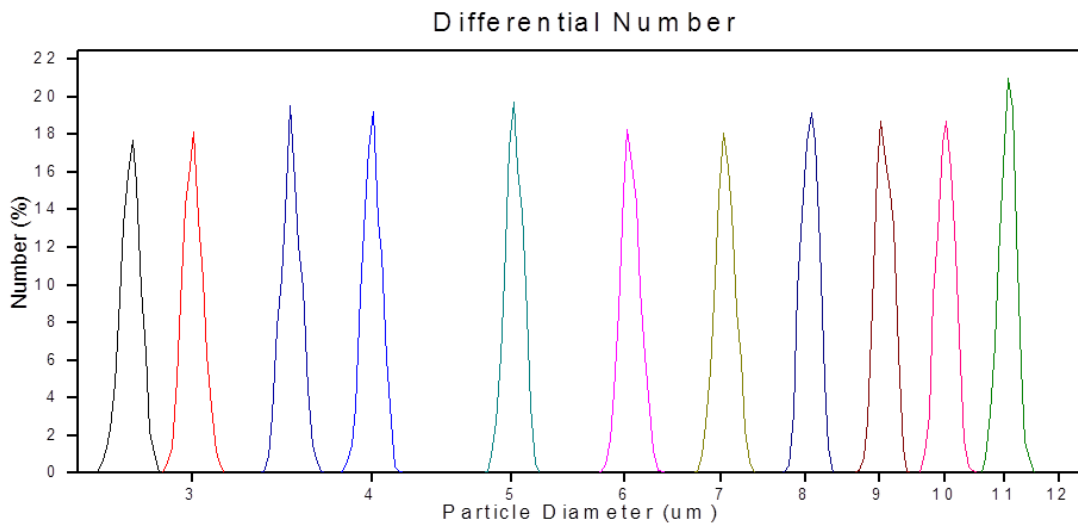
- ※ 微球粒径非常均一，变异系数 CV 小于 2.5%
- ※ 微球单分散性好，无重叠或团聚
- ※ 微球纯度高，无污染
- ※ 微球机械强度高， $K > 4500$
- ※ 微球具有优异的耐热性、耐寒性以及耐化学品性



UniSil®硅球间隔物的扫描电镜图

### UniSil®硅球间隔物粒径非常均一

UniSil®硅球的颗粒大小和分布是用国际公认的测试仪器（Beckman Coulter Counter Multisizer）和方法来确定的。为了确保结果的准确性，每次测量之前都用 NIST 可溯源标准颗粒来校正。UniSil®硅球粒径分布图说明纳微生产的 UniSil®硅球无论大小都具有高度的均匀性。变异系数，Coefficient Value (CV)%=(standard deviation/average diameter)x100，控制在 2.5% 以下。



UniSil®硅球间隔物粒径分布图（微球的粒径是用 NIST 溯源的标准颗粒校正的 Beckman Coulter Counter Multisizer 3 精确测试）

### UniSil®硅球纯度高，无污染

UniSil®硅球离子含量会直接影响到液晶的质量，因此我们在制备和清洗过程中都采用去离子水，产品定期抽样检查。

Substance	Control Limit	Test Method
Fe	≤ 2 ppm	ICP Spectrometer
Ca	≤ 2 ppm	
K	≤ 2 ppm	
Na	≤ 2 ppm	
Cl	≤ 1 ppm	Ion Chromatography

### UniSil®硅球间隔物符合 RoHS 指令

UniSil®硅球间隔物在生产过程中不使用任何欧盟 RoHS 指令中所禁止的元素，不含 RoHS 所禁止的有机物质及重金属，纳微每年更新一次 RoHS 检测报告。有需求的客户可以索要 RoHS 检测结果复印件。

Substance	Test Result (N.D. = Not Detectable)
Cd	N.D.
Pb	N.D.
Hg	N.D.
Cr <sup>6+</sup>	N.D.
PBBs	N.D.
PBDEs	N.D.

**UniSil®硅球物理特性**

检测项目	测试结果	测试方法
平均粒径, $\mu\text{m}$	$\pm 0.05$	库尔特粒度分析计数器 Coulter Counter
粒径分布 CV 值	1.0% -2.5%	库尔特粒度分析计数器 Coulter Counter
10% K 值 10% Modulus of Elasticity, $\text{kgf}/\text{mm}^2$	$> 4500$	Shimadzu MCT210
比重, $\text{g}/\text{cm}^3$	2.1	Multi-Volume Density test
热分解温度 Thermal Decomposition Temp, $^{\circ}\text{C}$ in air	不分解	-
折射率 Refractive Index	1.46	$20^{\circ}\text{C}$ , $\lambda = 589 \text{ nm}$

## UniSil®硅球间隔物产品目录

纳微科技提供两个系列 UniSil®硅球产品：Si 和 SiS。库存产品的粒径尺寸从 1.5 μm 到 25 μm，3 μm 到 9 μm 每隔 0.1 μm 一个标尺。其中 Si 系列主要用于边框合厚的控制，SiS 主要用于特殊要求的合内的合厚控制。

Series	Product	CV	Diameter	Increment	Application
Si	NM Si	≤ 2.5%	1.5 - 25.0 μm	0.10 μm	Side Spacer
SiS	NM SiS	≤ 2.0%	1.5 - 25.0 μm	0.10 μm	TN, STN

客户可以根据需求选择合适的 UniSil®硅球产品。

纳微科技拥有先进的技术，完善的生产和检测仪器设备，可以严格控制产品的质量。

通用准则：NM Si XXX；NM SiS XXX

NM - NanoMicro (纳微) 缩写

Si - 二氧化硅微球中适用于边框的产品；SiS - 二氧化硅微球中适用于盒内的产品

XXX - 粒径标称 如：065 - 6.5 μm, 100 - 10.0 μm

备 注：1. 粒径每间隔 0.1 μm 为一个产品规格，也可以根据客户需求特殊定制；

2. 可根据客户需求提供小于 1.5 μm 及 25.0 μm 以上大小的特殊品种；

3. 测试方法：Beckman Coulter counter Multisizer 3；

4. 变异系数计算方法：变异系数 (C.V.)%=(标准偏差/平均粒径)×100%。

### 联系方式：

苏州纳微科技有限公司

地址：苏州工业园区百川街 2 号，215123

电话：(86) 0512-6295 6000 或 400-828-1622

Fax: (86) 0512-6295 6018

邮箱：info@nanomicrotech.com

Http://www.nanomicrotech.com

扫一扫，更多精彩

